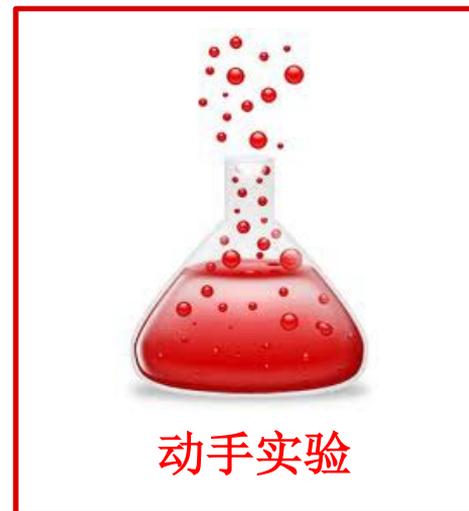


# Stellaris® ARM® Cortex™ M4F 培训

## 模拟外设

ADC 与模拟比较器

第 3 节 — 实习

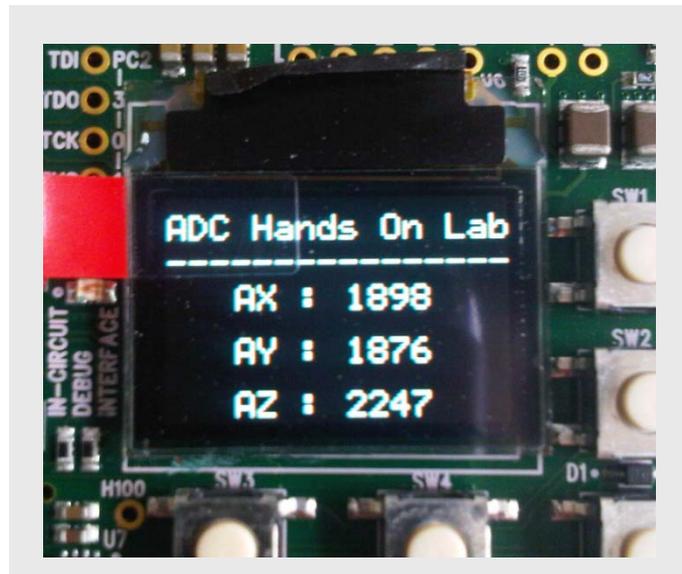


# 议程

- 实习一：三轴加速计
- 实习二：硬件求平均采样

# 实习一：目的

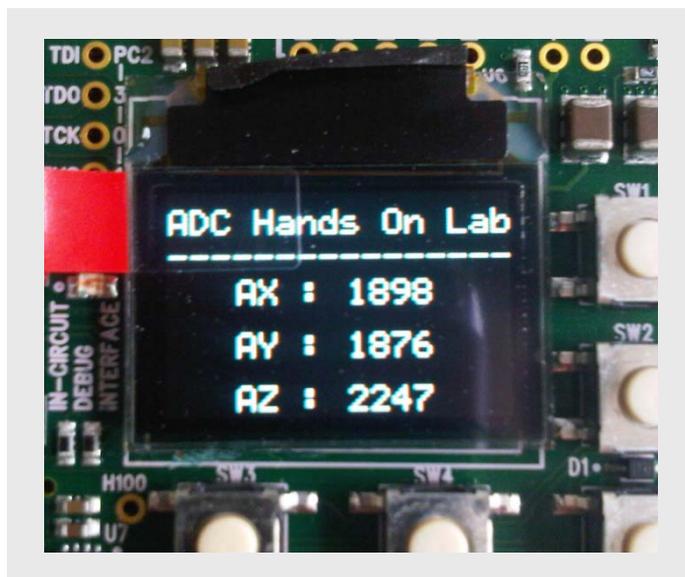
- 取一个现有的 **ADC** 项目（从第 2 节）。对其进行变更以采用采样序列 0 将多个（3 个）**ADC** 通道配置为单端模式，并捕获和显示用于三个轴（**x**、**y** 和 **z**）的加速计数据。
- 该实习一旦成功结束，屏幕上应立即出现如下显示。数值 **AX**、**AY** 和 **AZ** 将随着电路板取向的改变而变化。



实习一：截屏

## 实习二：目的

- 变更一个现有的项目（从实习一）并配置 ADC 模块以使用硬件平均排序电路。
- 该实习一旦成功结束，屏幕上应立即出现如下显示。数值 AX、AY 和 AZ 将随着电路板取向的改变而变化。
- 相比于实习一，这些数值将相对稳定。



实习二：截屏